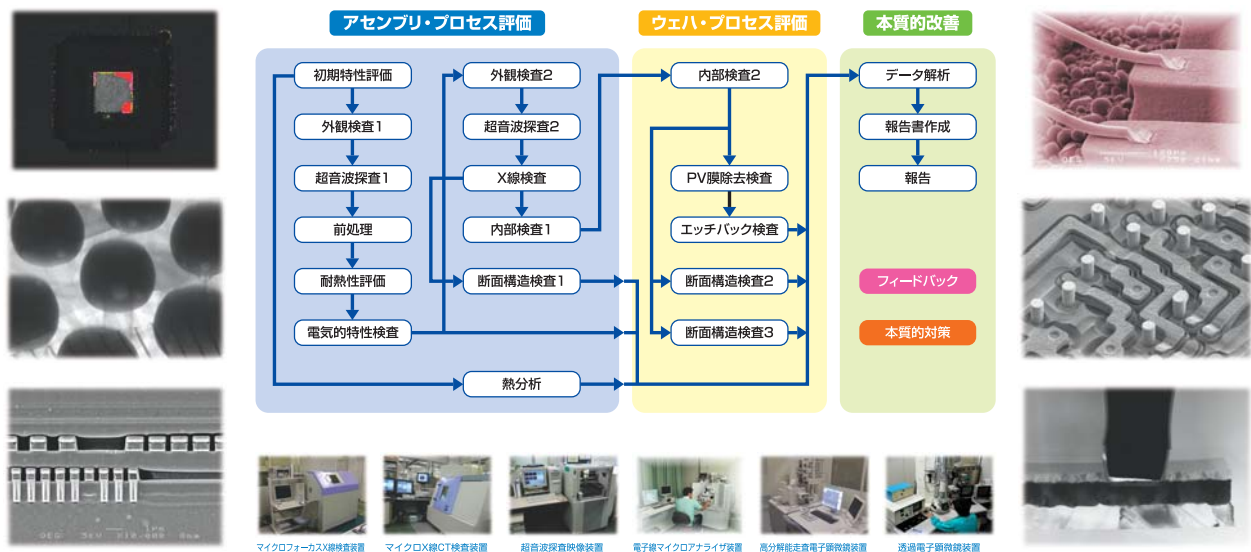


# 良品構造解析を利用した品質評価

- ◆ 潜在欠陥の検出力を高めた合理的な解析メニューを提供
- ◆ 故障に繋がる原因の除去による本質的な改善に利用可能
- ◆ 評価試験・スクリーニングの基礎情報の取得も可能

## 良品構造解析・LSIプロセス診断

◇客観的評価 ◇独自の判定基準 ◇バリエーションの提案



- ◆ 良品構造解析技術から生まれたリバース・エンジニアリング
- ◆ 信頼性設計・デバイス回路解析に利用可能

## NEW パターン解析 故障解析・回路解析に対応。ご要望に応じた平面加工を行います

- Step1** LSIチップの積層部を表層より順次平面研磨（+エッチバック）処理して各積層膜を平坦に加工し露出させます。 ☆高精度平面研磨
- Step2** 各界層の任意の部分パターンをSEMで連写撮影します。更に、取得した微細パターンを自動補正し、画像を繋ぎ合わせます。  
☆連続画像合成
- Step3** 水平・垂直方向の回路接続の解析が容易です。最新のLSIを短時間で回路解析することが可能となりました。回路解析に必要な情報を効率よく引き出すことが出来ます！ ☆高速画像再生

